

2020 年

- 2020-J1(W) 【招待講演】  
軟X線検出 CMOS イメージセンサ  
第 33 回日本放射光学会年会 放射光科学合同シンポジウム(日本放射光学会主催), 2020 年 1 月 12 日, 名古屋  
須川 成利
- 2020-J2(W) レーザーアニール法による低温多結晶 Si 薄膜の特性改善と電気特性評価  
一般社団法人レーザー学会学術講演会第 40 回年次大会, (2020), D02-20P-V-08, 2020 年 1 月 20 日, 仙台  
濱野 史暢, 妹川 要, 中村 大輔, 後藤 哲也, 池上 浩
- 2020-J3(W) 【招待講演】  
イメージング・デバイスの技術動向  
第 115 回研究会「イメージング・エレクトロニクス」(独立行政法人日本学術振興会 半導体界面制御技術第 154 委員会), (2020), pp.1-9, 2020 年 1 月 21 日, 東京  
黒田 理人
- 2020-J4(W) 【招待講演】  
IEDM2019 を振り返って  
先端 CMOS デバイス・プロセス技術 (IEDM 特集)(電子情報通信学会シリコン材料・デバイス研究会/応用物理学会シリコンテクノロジー分科会), (2020), 2020 年 1 月 28 日, 東京  
黒田 理人
- 2020-J5(W) 注入ゲート導入型ノーマリオフ Floating Gate GaN HEMT の動作原理と構造  
電子デバイス研究会 (ED)(一般社団法人 電子情報通信学会), (2020), Vol.119, No.408 ED2019-104, pp.55-58, 2020 年 1 月 31 日, 東京  
南雲 謙志, 木本 大幾, 諏訪 智之, 寺本 章伸, 白田 理一郎, 高谷 信一郎, 須川 成利
- 2020-J6(W) 【招待講演】  
YOF コーティングのプラズマ耐性  
応用物理学会シリコンテクノロジー分科会第 223 回研究集会, (2020), 2020 年 2 月 14 日  
後藤 哲也, 志波 良信, 寺本 章伸, 岸 幸男, 須川 成利
- 2020-J7(W) 高精度電流計測アレイテスト回路を用いた MIM 素子の大規模測定  
第 67 回応用物理学会春季学術講演会, (公益社団法人応用物理学会), p.11-086, 2020 年 3 月 12 日, 東京(新型コロナウイルス感染症対策のため中止)。  
鈴木 勇人, 朴 賢雨, 寺本 章伸, 黒田 理人, 諏訪 智之, 須川 成利
- 2020-J8(M) 高感度・高精細・リアルタイム近接容量イメージセンサ  
応用物理, 第 89 巻, 第 6 号(2020), p.328-332, 2020 年 6 月 10 日  
黒田 理人, 山本 将大, 須川 成利  
<https://doi.org/10.11470/oubutsu.89.6.328>
- 2020-J9(M) 超小型紫外線センシング Si フォトダイオード・イメージセンサー技術  
Optronics : 光技術コーディネータージャーナル(特集 紫外線光デバイス開発と実用化の期待)  
第 39 巻, 6 号(2020), pp.77-82, 2020 年 6 月  
黒田 理人, Yhang Ricardo Sipauba Carvalho da Silva, 須川 成利
- 2020-J10(M) 映像情報メディア年報 2020 シリーズ(第 10 回)情報センシングの研究開発動向  
映像情報メディア学会誌, 第 74 巻, 5 号, 2020 年 9 月 1 日  
秋田純一, 井口義則, 池辺将之, 丸山基之, 関根寛, 黒田理人, 香川景一郎, 小室孝, 徳田 崇, 船津良平, 西山円, 廣瀬裕, 藤澤大介, 杉山行信

- 2020-J11(W) 【招待講演】  
CMOS イメージセンサの広ダイナミックレンジ・高速・広分光感度性能の追究  
第 84 回半導体・集積回路技術シンポジウム(電気化学会電子材料委員会), 2020 年 9 月 15 日, オンライン  
須川成利
- 2020-J12(C) Si(551)表面の表面構造解析  
日本物理学会講演概要集(CD-ROM), 第 75 巻, p.2, No.11aJ1-2, 2020 年 9 月 23 日  
内藤完, 中塚聡平, 小川修一, 虻川匡司, 江口豊明, 服部賢, 服部梓, 黒田理人
- 2020-J13(W) トレンチ型 2 段 LOFIC を有する単一露光・線形応答・120dB 超広ダイナミックレンジ  
映像情報メディア学会技術報告・情報センシング研究会(一般社団法人 映像情報メディア学会), (2020), Vol. 44, No.11, p.81-84, 2020 年 9 月 24 日, オンライン  
藤原 康行, 村田 真麻, 中山 翔太, 黒田 理人, 須川 成利
- 2020-J14(W) 【展望講演(招待講演)】  
プラズマ成膜技術の将来展望  
化学工学会第 51 回秋季大会(公益社団法人 化学工学会), (2020), 2020 年 9 月 25 日, オンライン  
後藤 哲也
- 2020-J15(W) 【招待講演】  
半導体デバイスにおける欠陥評価 ～イメージセンサ・欠陥・プロセス～  
第 34 回プラズマ新領域研究会「プラズマプロセスにおける欠陥生成に関する新生面」研究会(応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会), (2020), 2020 年 10 月 21 日, オンライン  
黒田 理人
- 2020-J16(W) 3 次元積層に向けた高容量密度・高耐圧 SiN 絶縁膜粗面トレンチキャパシタの開発  
電子情報通信学会技術研究報告, シリコン材料・デバイス研究会(一般社団法人電子情報通信学会), (2020), Vol. 120, No.205, SDM2020-15, pp.7-11, 2020 年 10 月 22 日, オンライン  
齊藤 宏河, 吉田 彩乃, 黒田 理人, 柴田 寛, 柴口 拓, 栗山 尚也, 須川 成利
- 2020-J17(W) IPA を用いた銅・酸化銅上の表面改質  
電子情報通信学会技術研究報告, シリコン材料・デバイス研究会(一般社団法人電子情報通信学会), Vol. 120, No.205, SDM2020-19, pp.25-29, 2020 年 10 月 22 日, オンライン  
間脇 武蔵, 寺本 章伸, 石井 勝利, 志波 良信, 諏訪 智之, 東雲 秀司, 清水 亮, 梅澤 好太, 黒田 理人, 白井 泰雪, 須川 成利
- 2020-J18(W) 統計的計測によるドレイン-ソース間電圧がランダムテレグラフノイズに与える影響の解析  
電子情報通信学会技術研究報告, シリコン材料・デバイス研究会(一般社団法人電子情報通信学会), Vol. 120, No.205, SDM2020-21, pp.34-39, 2020 年 10 月 22 日, オンライン  
秋元 瞭, 黒田 理人, 寺本 章伸, 間脇 武蔵, 市野 真也, 諏訪 智之, 須川 成利
- 2020-J19(W) 超高速イメージセンサ, 紫外域イメージセンサ技術  
第 4 回「新機能イメージングデバイスおよび周辺技術分科会」(一般社団法人 電子情報技術産業協会), (2020), 2020 年 10 月 23 日, オンライン  
黒田 理人
- 2020-J20(W) MRAM 用 MgO 薄膜の信頼性に関する研究  
第 32 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング, (2020), pp.45-53, 2020 年 11 月 14 日, オンライン  
諏訪 智之, 土本 淳一, 寺本 章伸, 後藤 哲也, 朴 賢雨, 須川 成利

- 2020-J21(W) 【特別講演】  
半導体製造用成膜プロセスの高性能化に向けた取り組み  
第 32 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング, (2020), pp.55-58, 2020 年 11 月 14 日, オンライン  
後藤 哲也
- 2020-J22(W) Si(551)表面の W-RHEED と STM による構造解析  
日本表面真空学会学術講演会要旨集, 2020 年 11 月 19 日, オンライン  
内藤完, 中塚聡平, 小川修一, 虻川匡司, 江口豊明, 服部賢, 服部梓, 黒田理人
- 2020-J23(W) CMOS イメージセンサの感度・飽和・撮影速度・分光感度帯域性能の追究  
映像情報メディア学会 創立 70 周年記念大会 (映像情報メディア学会主催), 【企画セッション 3】映像情報メディアの発展を支えるイメージセンサ, 2020 年 12 月 22 日, オンライン  
須川 成利